

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

## Objectifs Plan APO SWIR PE IR 1X



SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective

Stock **#26-217** **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €16.880<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+	€16.880,00 prix unitaire
--------	--------------------------

Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>
------------	----------------------------------

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):  
420

### Propriétés optiques

Distance Focale FL (mm):  
200.00

Grossissement:  
1X

0.03	<b>Ouverture Numérique NA:</b>
22.4	<b>Pouvoir de Résolution (µm):</b>
611.00	<b>Profondeur de champ (µm):</b>
Not Available	<b>Correction Couvre Objet:</b>
12	<b>Distance de Travail (mm):</b>
800 - 1600	<b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b>
24.00	<b>Cercle Image Max. (mm):</b>

## Filetage & montage

M26	<b>Filetage:</b>
-----	------------------

## Conformité réglementaire

<a href="#">Visionner</a>	<b>Certificate of Conformance:</b>
---------------------------	------------------------------------

## Description produit

- Haute résolution pour les longueurs d'onde de l'infrarouge à ondes courtes (SWIR) jusqu'à 1600 nm
- Disponibles dans des grossissements de 1X à 50X
- Idéaux pour la détection par photoémission, le marquage laser et la découpe laser

Les Objectifs SWIR Plan APO Corrigés à l'Infini sont des objectifs à haute résolution avec de longues distances de travail qui se caractérisent par une correction de couleur entre 800 et 1600 nm. Disponibles avec des grossissements de 1X à 50X, ces objectifs présentent des ouvertures numériques élevées pour une imagerie à haute résolution aux longueurs d'onde SWIR. Avec une distance parfocale commune de 95 mm, ces objectifs peuvent être associés à une lentille tube de 200 mm de distance focale et à une [caméra compatible de monture C](#) pour faciliter l'intégration dans des systèmes. Les Objectifs SWIR Plan APO Corrigés à l'Infini sont idéaux pour la détection par photoémission, l'inspection de la face arrière des cartes de circuits imprimées, la découpe du verre au laser et les applications de microscopie à balayage laser.